PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-129581

(43) Date of publication of application: 16.05.1997

(51)Int.CI.

H01L 21/304 H01L 21/3065 H01L 21/68 // H01L 21/60

(21)Application number : 08-256101

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

27.09.1996

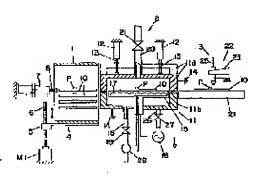
(72)Inventor: MORISAKO ISAMU

(54) PLASMA CLEANING DEVICE OF BOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plasma cleaning device which is capable of cleaning off stains attached to a board before a wire bonding operation is carried out.

SOLUTION: A substrate plasma cleaning device 2 is equipped with a freely openable vacuum easing 11 composed of an upper case 11a and a lower case 11b, wherein a support means 15 which supports a board 10 is provided inside the vacuum easing 11. When a high voltage is applied to the support means 15 from a power supply 16, plasma is generated inside the vacuum easing 11, and stains attached to the surface of the board 10 placed on the support means 15 are removed off by plasma of molecule or ion. The cleaned board 10



is delivered to a board guide 21 by a pusher, and a wire bonding operation is performed onto the board 10 by a wire bonder 3. The pusher is made to advance or retreat repeatedly to successively deliver the cleaned board 10 placed on the support means 15 onto the board guide 21.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.09.1996

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2828066

[Date of registration]

18.09.1998

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-129581

(43)公開日 平成9年(1997)5月16日

(51) Int.CL.		鉄別配号	庁内整理番号	FΙ				-	技術表示實際	
HOIL	-	3 4 1		HOIL	-		3411	_		
	21/3065 21/63				21/68 21/60 21/302		A 301A			
# H01L	21/60	3 0 1					1	N		
				寄査	水瓶	有	前求項の数1	or	(全 4	頁)
(21)出職番号 (62)分割の表示		特顧平8-256101 特顧平3-76232の分割		(71)出廢人 000005821 松下電器産業株式会社						

(22)出願日

平成3年(1991)4月9日

大阪府門真市大学門真1006番地

(72) 発明者 森迫 勇

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

企業株式会社内

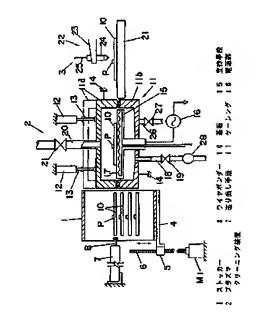
(74)代理人 弁理士 滝本 智之 (外1名)

(54) 【発明の名称】 基板のプラズマクリーニング装置

(57)【要約】

【課題】 ワイヤボンディングなどに先立って、 釜板に 付着する汚れをきれいにクリーニングできる基板のブラ ズマクリーニング装置を提供すること。

【解決手段】 益板のプラズマクリーニング装置2は、 上ケース11aと下ケース11bから成る開閉自在な真 空ケーシング11の内部に基板10の支持手段15を備 える。支持手段15に電源16から高電圧を印加する と、真空ケーシング11の内部にプラズマが発生し、プ ラズマの分子やイオンにより支持手段15上の基板10 の表面の汚れは除去される。クリーニングが終了する と、押送子により基板10は基板ガイド21へ送り出さ れ、続いてワイヤボンダー3によりワイヤボンディング が行われる。押送子は、前進・後退動作を繰り返し、支 持手段15上でクリーニングが終了した基板10を基板 ガイト21上へ次々に送り出す。



特開平9-129581

【特許請求の範囲】

【請求項1】開閉自在な真空ケーシングと、この真空ケ ーシングの内部に設けられた基板の支持手段と、この支 持手段に電圧を印加してプラズマを発生させる電源部 と、前記支持手段上の基板を前記真空ケーシングから前 記真空ケーシングの側部に配設された基板ガイドへ送り 出す送り出し手段とを備え、前記送り出し手段が、前記 支持手段上の基板の後面に押当して基板を押送する押送 子と、この押送子に前進・後退動作を行わせる駆動手段 を有することを特徴とする基板のプラズマクリーニング 10 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の層する技術分野】本発明は、電子部品が実装さ れる墓板の表面をクリーニングする墓板のフラズマクリ ーニング装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体デバイスの製造工程において、基 板に搭載された半導体の電極と、基板の電極とをワイヤ で接続することが行われる。このようなワイヤボンディー ング工程において、基板の電極に汚れが付着している と、ワイヤを電極に良好にボンディングすることはでき ない。この汚れとしては、作業者が基板を手で取り扱っ た場合に付着する手脂、空気中に浮遊するガス化したオ イル、レジストの残渣等がある。

【0003】ワイヤボンディングに先立って、このよう な汚れを除去するための手段として、従来、超音波洗浄 が行われていた。超音波洗浄は、基板を純水などのクリ ーニング液中に浸漬し、このクリーニング液に超音波を 印加して、汚れを除去する手段である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが超音波洗浄手 段は、その後に熱風を吹き付けるなどして基板を乾燥さ せねばならないため、手間と時間を要し、また乾燥させ ると、クリーニング液がしみとなって基板表面に残存し やすい等の問題点があった。このような基板の汚れは、 ワイヤボンディングに限らず、基板に電子部品を実装す る場合などにも問題になるものである。

【0005】そこで本発明は、従来手段の問題点を解消 る基板のプラズマクリーニング装置を提供することを目 的とする。

【課題を解決するための手段】本発明は、開閉自在な真 空ケーシングと、この真空ケーシングの内部に設けられ た墓板の支持手段と、この支持手段に電圧を印加してブ ラズマを発生させる電源部と、前記支持手段上の墓板を 前記真空ケーシングから前記真空ケーシングの側部に配 設された基板ガイドへ送り出す送り出し手段とを備え、 前記送り出し手段が、前記支持手段上の基板の後面に押 50 送気パイプ、21はバルブであって このパイプ20か

当して基板を押送する押送子と、この押送子に前連・後 退動作を行わせる駆動手段を有する構成とした。 [0007]

【発明の実施の形態】上記構成において、真空ケーシン グ内の支持手段上に基板を載せ、支持手段に電圧を印加 すると真空ケーシング内にプラズマが発生し、プラズマ の分子やイオンが基板の表面に衝突してその汚れを除去 する。クリーニングが終了したならば、真空ケーシング を開き、押送子に前進動作を行わせて支持手段上の基板 を墓板ガイドに送り出す。

【0008】次に、図面を参照しながら本発明の実施の 形態を説明する。図】は本発明の一実施の形態の基板の ストッカーとプラズマクリーニング装置とワイヤボンダ ーの側面図、図2は同基板のプラズマクリーエング装置 に備えられた基板の送り出し手段の平面図である。図1 において、リードフレームなどの基板 1 0 のストッカー 1と、プラズマクリーニング装置2と、ワイヤボンダー 3が並設されている。基板10には半導体Pが搭載され ている。

【0009】ストッカー1には、基板10が段積みして 収納されている。4はストッカー1の支持板であって、 ナット5が装着されている。このナット5にはボールね じ6が螺合している。M1はボールねじ6を回転させる モータである。

【0010】ストッカー1の背後には、送り出し手段と してのシリンダ7が設けられている。モータM1を駆動 して、ストッカー1を昇降させ、基板10をシリンダ7 のロッド8の前方に位置させて、ロッド8が突出する と、墓板10は前方へ押送される。

【0011】プラズマクリーニング装置2は、上ケース 11aと下ケース11bから成る真空ケーシング11を 主体としている。上ケース11 a はシリンダ12のロッ ド13に支持されており、ロッド13が突役すると、上 ケース11aは昇降して、ケーシング11は開閉する。 上ケース11aと下ケース11bはアース部14により 接地されている。

【0012】ケーシング11の内部には、基板10の支 持手段15が配設されている。この支持手段15はカソ ードを兼務しており、電源部16により高電圧が印加さ し - 参板の表面を作業性よくきれいにクリーニングでき 40 れる。この支持手段15にはヒータ17が埋設されてお り、ワイヤボンディングに先立ち、墓板10を加熱す る。このように、プラズマクリーニング装置2に基板1 0の加熱手段であるヒータ17を設けることにより、ワ イヤボンディングに先立ち、段取りよく基板 10を予熱 できる。

> 【0013】18は吸引バイブ、19はバルブ、28は ボンプであって、ケーシング11内の気体を吸引して、 ケーシング11を真空にする。26、27はケーシング 11を常圧に戻すためのパイプとバルブである。20は

らケーシング1 1内に、プラズマ放電用ガスとして、A rガスのような不活性ガスが供給される。

【0014】ワイヤボンダー3は、基板10のガイド手段21と、このガイド手段21の上方に設けられたボンディング手段22から成っている。ボンディング手段22は、ホーン23と、このホーン23に保持されたキャピラリツール24を備えており、このキャピラリツール24に挿通されたワイヤ25により、基板10上の半導体Pと基板10を接続する。ガイド手段21は、上記支持手段15と同じレベルに設けられている。

【0015】図2は、支持手段15上の基板10をワイヤボンダー3側へ送り出す送り出し手段の平面図である。30はアーム状の押送子であって、ナット31には X方向のボールねじ32が螺台している。33はボールねじ32を駆動するモータである。

【0016】モータ33は、ナット34に支持されている。35はこのナット34に螺合するY方向のボールねじ、36はモータである。

【0017】モータ33が駆動して、ボールねじ32が 回転すると、ナット31はこのボールねじ32に沿っ て、X1方向に摺動し、上記押送子306X1方向に前 進する。これにより、押送子30は基板10の後面に押 当して基板10を右方(ワイヤボンダー3側)へ押送す る。またモータ36が駆動すると、ナット34はボール ねじ35に沿ってY1方向に摺動し、押送子30もY1 方向に後退する。またモータ33が逆駆動してボールね じ32が逆回転すると、同様にして押送子30はX2方 向へ後退し、またモータ36が逆駆動してボールねじ3 5が逆回転すると、押送子30はY2方向へ前進する。 37は上記支持手段15上に設けられた基板10のガイ 下部である。このように、押送子30をX1, X2, Y 1、Y2方向へ移動させることにより、支持手段 15上 の基板 1 ()を繰り返しワイヤボンダー 3 側へ搬送する。 【りり18】本装置は上記のような構成より成り、次に 動作の説明を行う。上ケース11aを開いた状態で、シ リンダ7のロッド8が突出することにより、ストッカー 1の基板10はケーシング11内の支持手段15上へ送 られる。次いで上ケース 1 1 a が閉じ、ケーシング 1 1 内には真空状態になる。またパイプ20から不活性ガス が送られ、次いで支持手段15に高周波高電圧が印加さ 40 れることにより、プラズマが発生する。

【0019】またこれとともに、不活性ガスの一部はイオン化し、イオンはケーシング11内を激しく高速運動して、基板10の表面に衝突し、この表面に付着する不

【0020】次いでケース11aは上昇して、ケーシング11を開く。次いでモータ36が駆動して、押送子30はY2方向へ前進して支持手段15上の基板10の背後に伸出し(図2鎖線参照)、次いでモータ33が駆動して、押送子30がX1方向へ前進することにより、基10板10はワイヤボンダー3のガイド手段21上へ押送される(図2破線参照)。基板10をワイヤボンダー3側へ押送した押送子30は、Y1方向へ後退するとともにX2方向へ後退し、次の基板10の押送のために待機する。

0 【0022】本発明は上記実施例に限定されないのであって、例えば真空ケーシングの前面と後面に開閉扉を設け、この開閉扉を開閉して、基板10を出し入れするようにしてもよい。

[0023]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ワイヤポンディング工程などに先立って、基板に付着する 汚れを作業性良く且つきれいに除去することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態の基板のストッカーとプラズマクリーニング装置とワイヤボンダーの側面図 【図2】本発明の一実施の形態の基板のプラズマクリーニング装置に備えられた基板の送り出し手段の平面図

【符号の説明】

ストッカー
プラズマクリーニング装置

3 ワイヤボンダー

7 送り出し手段

10 基板

11 ケーシング

15 支持手段

16 電源部

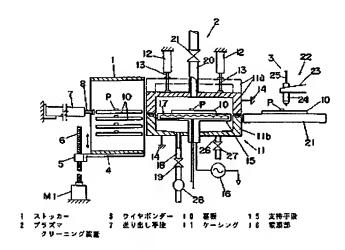
30 押送子

32.35 ボールわじ

33.36 モータ

特開平9-129581





[22]

